高精度測定をサポー トする原理と機能

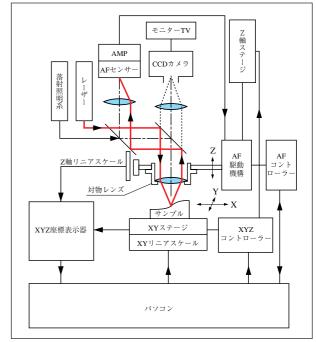
● 測定原理

顕微鏡鏡筒に送り込まれたレーザー光は、対物レンズを 通り、光軸中心の焦点面に向かって進み、サンプル表面 に反射して再び対物レンズを通って AF センサー部に結像 します。フォーカスが合っていない時、レーザーの位置 が変化します。この位置変化をセンサーが捉え、AF 駆動 機構を用いて対物レンズをフォーカスポイントへ位置決 めします。ワークを自動 XY ステージでスキャニングさせ、 オートフォーカスした各ポイントの XYZ の座標値をコン ピューターに取り込み測定します。

この方式は、"ステージ走査型レーザープローブ式"とい い、ワークの表面形状や、色、反射率に左右されない高 精度な三次元測定を行うことができます。

又、レーザーのスポットは直径 $2 \mu m$ (50 倍時) と非常 に小さく、これをプローブとして表面形状を探り、幅、 高さ等の寸法測定を全自動で行います。

(※ 100 倍で約 1 μmまで集光します。)

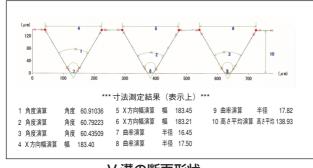


オートフォーカス原理図

● 測定機能

1) 断面形状/三次元形状測定

ワークの表面形状や色、反射率、傾斜、エッジの散乱光等の影響を受けないオートフォーカスシステムは、数 mm の段差を $0.01~\mu$ m の分解能で高速に測定し、真の表面形状を探ります。

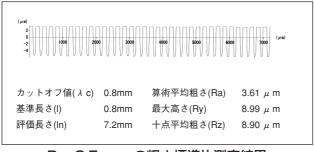


V 溝の断面形状

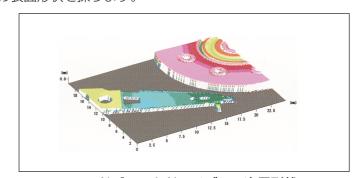
2) 表面粗さ測定

数 μ mのレーザービームをプローブとして用いる ことにより、触針式の測定器では不可能であった、 触れると変形するものや、傷がついては困るもの、 さらには数 μ m 程度の溝の凹凸まで非破壊で高精 度に測定します。

又、結果出力は94年2月に改正された新JIS規 格に準じた、Rmax、Ra等を出力します。



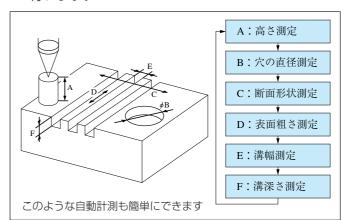
Ra=3.5 µ m の粗さ標準片測定結果



ハードディスクドライブの三次元形状

3) 三次元自動寸法測定

レーザービームと高精度自動 XY ステージが測定者 の目と手に代わり μ mオーダーの精度で、精密部 品や金型等の高さ、溝幅、穴径、傾斜角度、R測定、 そり、平面度等品質管理に不可欠な測定を全自動で 行います。

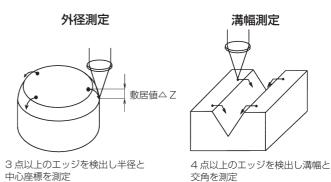


● 段差から XY 座標を計るエッジ検出機能

— 測定困難なR面の端面も高精度検出 —

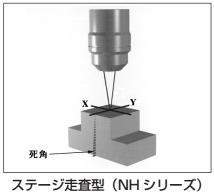
般の非接触寸法装置は、CCD カメラ等を用いて画像 の濃淡度を敷居値としてエッジを検出するのに対し、 NH シリーズでは形状を測定し、表面からの高さ△ Z を 敷居値としてワーク端面を検出します。そのため表面の 色や反射率に左右されず、広い範囲を高精度に測定でき ます。大容量、高精度化する半導体や光デバイス、精密 部品の寸法測定に不可欠な測定機能です。(特許取得済)

(測定分解能 X = 0.1、Y = 0.1 μ m) (測定範囲:ステージ可動範囲内全域)

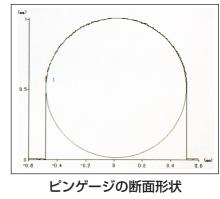


● 急斜面の断面形状測定を可能にしたステージ走査方式

レーザー光を用いた形状測定器の多くは、レーザー光線をミラー等で XY に走査し三次元形状測定を行っています。 この場合、光軸中心から放射状にレーザー光が当たらない部分(死角)ができます。一方 NH シリーズでは、レーザー 光は Y 軸方向に配置され光軸中心をフォーカスしているため、X 方向の死角がなく、表面粗さを持っているワークに 対し90°近い急斜面の測定が可能です。



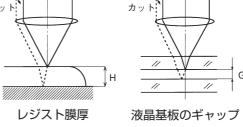


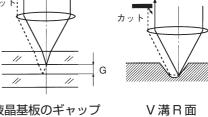


測りたい場所だけの光を捕らえる 測定表面の近傍に強い反射面があるものやゴース

トが出やすいサンプル等、非接触では測定が困難 とされていたものでも NH シリーズは高精度に測 定できます。それは周りの散乱光を効率よくカッ トする AF 光学系とハイブリッド AF テクノロジ 一が測定の信頼性を上げているのです。

— ゴースト、迷光に強い AF 光学系 —





■ 高精度、高剛性 XY ステージが測定の基本 "高精度測定=しっかりしたメカ"の観念をもって NH シリーズの自動 XY ステージは 1 台 1 台丹念に仕上げ検査を 施しているため、非常に高精度な走り平行度を実現しています。

